

Microscopie à Force Atomique Spécialité « mesure infrarouge »

Objectif - Compétences acquises :

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : • Comprendre la théorie relative au fonctionnement du microscope AFM nanoIR (Anasys Instruments). • Réaliser et analyser des spectres infrarouges avec un AFM « nanoIR ».

Public concerné :

- Académique
- Industriel

Durée :

- 2 jours

Date/lieux :

- Nous consulter
- Non défini

Equipe pédagogique :

- Spécialiste du domaine

Approche pédagogique :

- Alternance de cours et de travaux pratiques

Renseignement pédagogique :

- Agnus Guillaume
- guillaume.agnus@u-psud.fr

Frais de participation individuels :

- 2000 € HT

Renseignements et inscriptions :

- Inscription : Service de Formation Continue de PARIS SUD
- Tél : +33(0)
- Fax : +33(0)
- Email : formation.continue@u-psud.fr
- Date limite d'inscription : 1 mois avant

Nombre de places limitées :

- Min/Max : 2 à 4 personnes

Prérequis :

- Connaissance de l'AFM standard ou formation AFM standard déjà validée

Compétences acquises :

- Comprendre la théorie relative au fonctionnement du microscope AFM nanoIR (Anasys Instruments) • Réaliser et analyser des spectres infrarouges avec un AFM « nanoIR »

Programme :

JOUR 1

- Matin (3h) : Théorie nanoIR
- Après-midi (4h) : Travaux pratiques, réalisation de spectres IR sur film minces de polymères

JOUR 2

- Matin (3h) : Travaux pratiques : analyse et identification d'un film polymères inconnu.
- Après-midi (4h) : Travaux pratiques : cartographie chimique à l'échelle nanométrique.

Validation :

Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de participation. Une évaluation de fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant l'atteinte des objectifs pédagogiques.

